
**Surface chemical analysis — Depth
profiling — Non-destructive depth
profiling of nanoscale heavy metal
oxide thin films on Si substrates with
medium energy ion scattering**

*Analyse chimique des surfaces — Profilage d'épaisseur — Profilage
d'épaisseur non destructif de films minces d'oxydes de métaux lourds
à l'échelle nanométrique sur des substrats de Si par diffusion d'ions de
moyenne énergie*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn